

マスクブランクス 装置売上 5.3倍

PR

LAZIN

列真（レージン）は独自のレーザーสキャン技術を強みに、2015年に創業したレーザー検査装置のベンチャー企業。シリコンやガラスなどの素材表面や内部のキズ・異物混入の検査をする。半導体デバイスのシリコンウエハー上への回路図の転写に用いられるフォトマスクブランクの検査装置や、液晶パネル（FPD）の検査装置を主軸に、国内外で受注が伸長している。張東勝社長は「研究・開発や生産で欠かせない検査装置で、半導体産業に貢献したい」と語る。



列真株式会社
代表取締役

張東勝氏

張社長は「技術力とコストメリット、装置のメンテナンスサービースで差別化し、検査できる素材もシリコンだけでなく汎用性の高い検査装置として受け入れられている」とし、

ミドルレンジの検査領域

半導体製造装置や素材の需要が高まっている。パソコンやサーバーなど情報通信機器だけでなく、自動車のエレクトロニクス化や電動車（EV）の普及拡大に加え、航空機や鉄道、社会インフラなどに半導体デバイスが実装されており、重要な部品となっている。

世界的な半導体供給課題がある

中、世界の半導体デバイスメーカーや半導体受託製造（ファウンドリー）は、増産や新規設備投資を活性化させ、半導体製造装置や素材の需要も過去最高の売り上げを更新している。

こうした中、列真は検査感度が0.1μm～0.3μmのミドルレンジとよばれるゾーンの検査装置市場をターゲットにしている。

張社長は「技術力とコストメリット、装置のメンテナンスサービースで差別化し、検査できる素材もシリコンだけでなく汎用性の高い検査装置として受け入れられている」とし、

「22年度の売上高は前年比約5.3倍の5億円が見えてきている」と強調する。

0.3μmのキズや欠陥、異物は人の目で確認することは困難であ

り、装置と自動化で半導体産業に貢献できると考えた。またコストメリットの高いミドルレンジの専用機が市場に少ないこともビジネス創出の機会と捉える。

メンテナンスで培った技術力

「創業前は個人で検査装置のメンテナンスに従事していたことが、技術力を育んでくれた」（張社長）と創業の原点を語る。

2年かけて開発した検査装置第1号を、19年に日本企業から受注。「研究・開発において、ガラス内部を検査したいという要望。開発の苦労が報われ、ビジネスの転機を迎えた」（同）と振り返り、発注企業に感謝する。

一方で中国の半導体産業はハイエンドクラスよりもミドルクラスのニーズが高いことから、中国企業が

らの受注も多い。山東省済南市にメンテナンスオフィスを設けているが、6月には江蘇省南京市にメンテナンスとセールスが行える事務所を新設した。

日本は半導体産業だけでなく、多くの研究機関（R&D）や素材研究の最先端市場にある。張社長は「当社技術力は日本のユーザーの要望に応えることで、世界で戦えると考えている。『測れない素材をなくす』をテーマに、検査感度を高めた製品の開発を視野に入りたい。5年後には売上高10億円を目指す」と意気込む。

注力するフォトマスク欠陥検査装置



LODAS-AI50

高速に検査可能な「LODAS-AI50」と検査感度0.1μmの「同-AI100」は、半導体用フォトマスクブランクスの出荷検査やプロセス評価に最適な自動検査装置で、パーティクルに加え、オフショで内部の欠陥を検査する。また微分干渉顕微鏡にて欠陥解析もできる。

に加え、488nm、525nmの波長から選択が可能。そのため、さまざまな素材の検査もできる。さらなる光源のバリエーション拡大も予定している。



LODAS-BI8

「LODAS-BI8」はレーザー光と反射散乱光、透過散乱光、共焦点光を用いたハイブリッド検査装置で、クロム膜とハーフトン膜、レジスト膜におけるパーティクル、スクラッチ、ピット、気泡の検査が可能。表面の欠陥だけでなく、内部や裏面も同時に欠陥検査できる。

レーザー光源の波長は405nm、6μmウエハーに対応し、1枚当たり180秒で手動検査できる。



列真株式会社

<https://www.lazin.jp>

〒140-0003 東京都品川区八潮 1-1-2 八潮中一ビル 3F
TEL : 03-6451-4379 代表取締役 張 東勝氏



ホームページ